热处理温度对 ZrO_2 薄膜表面形貌和结构的影响

冀国俊,张 薇,张智慧

(内蒙古工业大学化工学院,呼和浩特 010051)

摘要:采用溶胶一凝胶法,在 302 不锈钢表面制备了经不同温度热处理的 ZrO₂ 薄膜。通过原子 力显微镜 (AFM)、X 射线衍射仪 (XRD) 和傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR),研究了热处理温 度对 ZrO₂ 薄膜表面形貌和相结构的影响。研究结果表明:室温下 ZrO₂ 结构呈非晶态,随着温 度升高,晶体结构逐渐由四方相 (t-ZrO₂) 向单斜相 (m-ZrO₂) 转变;当热处理温度从400 °C升 高到 600 °C 时,薄膜表面 ZrO₂ 晶粒尺寸由 40 nm 逐渐增大到 70.1 nm,表面粗糙度也由 3.34 nm缓慢增大到 5.3 nm;而当热处理温度为 700 °C 时,ZrO₂ 晶粒明显增大 (109 nm),表面 粗糙度迅速增大到 33 nm;红外吸收谱显示,随着热处理温度的升高,非晶态 ZrO₂ (648 与 460.9 cm⁻¹)逐渐向 480.2 和 574.7 cm⁻¹处的 t-ZrO₂ 结构以及 424.3 和 732.8 cm⁻¹处的 m-ZrO₂ 结构转变,与 XRD 结果一致。

关键词: ZrO₂ 薄膜; 溶胶 – 凝胶; 热处理; 表面形貌; 晶体结构 中图分类号: O484.5 文献标识码: A 文章编号: 1671-4776 (2015) 03-0173-05

Influences of the Annealing Temperature on the Surface Morphology and Structure of ZrO₂ Thin Films

Ji Guojun, Zhang Wei, Zhang Zhihui

(College of Chemical Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China)

Abstract: The ZrO₂ thin films annealed at different temperatures were prepared on the surface of the 302 stainless steel substrates by the sol-gel method. The influences of the annealing temperature on the surface morphology and phase structure of ZrO₂ thin films were researched by atomic force microscopy (AFM), X-ray diffractometer (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results indicate that the ZrO₂ films present amorphous structure at room temperature, and then the crystal structure of ZrO₂ transforms from tetragonal phase (t-ZrO₂) to monoclinic phase (m-ZrO₂) with the increase of the temperature. When the annealing temperature increases from 400 °C to 600 °C, the grain sizes of ZrO₂ thin films increase from 40 nm to 70, 1 nm and the surface roughness slowly increases from 3, 34 nm to 5, 3 nm. When the annealing temperature is 700 °C, the ZrO₂ grain sizes increase significantly (109 nm) and the surface roughness rapidly increases to 33 nm. The FTIR results show that the amorphous ZrO₂ (424, 3 and 460, 9 cm⁻¹) gradually transforms to t-ZrO₂ (480, 2 and 574, 7 cm⁻¹) and m-ZrO₂ (424, 3 and

基金项目:国家自然科学基金资助项目(11462017);内蒙古自治区自然科学基金资助项目(2014BS0104)

E-mail: jgj@imut. edu. cn

收稿日期: 2014-12-12

732. 8 cm^{-1}) with the increase of the annealing temperature, which are consistent with the results of XRD.

Key words: ZrO₂ thin film; so⊢gel; annealing; surface morphology; crystal structure DOI: 10.13250/j. cnki. wndz. 2015. 03. 007 EEACC: 0590

0 引 言

近年来, ZrO_2 因其强度高、硬度好、断裂韧 性强和耐磨耐蚀等特征,成为最有应用前景的涂层 材料之一^[1]。特别是其热膨胀系数($1.2 \times 10^{-5} \sim$ $1.4 \times 10^{-5} K^{-1}$)与多数金属和高温合金相近^[2], 是耐蚀与抗氧化的理想涂层材料^[3],因而可广泛用 于航空航天、钢铁冶金、机械制造、光学和电学等 领域^[4]。

目前,常用的 ZrO₂ 薄膜制备方法有物理气相 沉积法 (PVD)、化学气相沉积法 (CVD)、等离 子喷涂法、热喷涂法、电沉积法与溶胶一凝胶法 等。其中,溶胶一凝胶法由于反应温度低、前驱溶 液配比可控性强、产物粒径小、分布均匀且易于实 现高纯化、退火温度低、制造设备简单廉价,成为 最有发展前景的涂层方法。

近年来,国内外关于 ZrO₂ 薄膜的研究,主要 集中在 ZrO₂ 薄膜结构、性能及其应用领域。如: V. S. Dang 等人^[5]在不同温度下通过金属有机化学 气相沉积法 (MOCVD) 分别在硅片与玻璃基体上 沉积了 ZrO₂ 薄膜,结果表明在 500 ℃下沉积的 ZrO₂ 薄膜可见光透光率大于 80%, 其平均折射率 达到 2. 14; K. J. Patel 等人^[6]采用 PVD 法在全固 体薄膜电致变色设备上沉积了 ZrO» 薄膜,研究了 ZrO₂ 薄膜厚度对设备透射调制和记忆效应的影响; B. Liang 等人^[7] 利用等离子喷涂法制备了纳米 $ZrO_2-Y_2O_3$ (YSZ) 涂层, 并采用 X 射线衍射技术 和透射电镜对涂层的显微结构进行了研究,发现涂 层主要由直径小于 100 nm 的柱状颗粒组成,且其 摩擦系数仅为常规的 1/5, 磨损率也降低一个数量 级; D. Min 等人^[8] 通过化学溶液法在高电阻率硅 晶片和金属层上制备了 ZrO₂ 薄膜,采用共面波导 与顶部圆形电极的金属层 — 绝缘层 — 金属层 (MIM) 电容器对薄膜的介电性能进行了研究,认 为该薄膜可作为射频(RF)和微机电系统

(MEMS) 的理想介电层。

目前对 ZrO₂ 薄膜的研究较多,但对于 ZrO₂ 薄膜通过烧结处理后其表面结构状态等特性的研究 还不够深入,而这些特性对于 ZrO₂ 薄膜的表面结 构及性能等有着重要的影响。本文采用浸渍一提拉 法在不锈钢基体上制备了 ZrO₂ 薄膜,研究了不同 的烧结处理温度对 ZrO₂ 薄膜晶体结构和表面形貌 的影响。

1 实验

以尺寸为 20 mm×10 mm 的 302 奥氏体不锈 钢为基体材料,将试样打磨抛光至镜面,然后在无 水乙醇中超声清洗。以锆酸四丁酯 $(C_{16}H_{36}O_{4}Zr)$ 、 无水乙醇(分析纯)和冰乙酸(分析纯)为涂膜原 料。首先,在烧杯中加入一定量无水乙醇,于室温 剧烈搅拌下依次滴加锆酸四丁酯、冰乙酸(体积比 为 20:8:1), 继续搅拌 20 min 得到均匀透明的 淡黄色溶液。然后,剧烈搅拌下滴加 HCl-乙醇溶 液 (HCl、无水乙醇和 H_2O 的体积比为 1:30: 1), 继续搅拌 0.5 h 得到均匀透明的淡黄色 ZrO_2 溶胶。将所得溶胶在室温下陈化 24 h,将基板以 10 cm/min 的速度置于溶胶中并以同样速度提拉基 板,进行涂覆。然后将涂膜样品在100℃下干燥 1 h后,在空气中以 5 ℃/min 的升温速率至 400~ 700 ℃,保温1h进行热处理。将另一部分溶胶液 体在 100 ℃下干燥 3 h 后,同样在空气中以 5 ℃/ min 的升温速率至 400~700 ℃,保温1h进行热 处理制得干凝胶粉体。

采用日本理学 $D/MAX-2500/PC ext{ 型 X 射线衍$ $射仪(阳极靶材料为 Cu, 扫描范围 <math>10^{\circ} \sim 80^{\circ}$, 扫 描速率 $3^{\circ}/min$)对 ZrO_2 粉末进行物相分析;采用 原子力显微镜(本原 CSPM4000, 扫描频率为 1.0 Hz)观察涂膜试样的表面形貌;采用美国尼 高力仪器公司生产的 Nexus670 傅里叶变换红外光 谱仪测定 ZrO_2 的红外光谱。

174

2 结果与讨论

2.1 XRD 分析

图 1 为 ZrO₂ 干凝胶经不同热处理温度下的 XRD 图谱。如图 1 (a) 所示,在 25 ℃时, XRD 谱线没有明显的衍射峰存在,说明该温度下 ZrO₂ 的结构为非晶态。经 400 ℃热处理后,如图 1 (b) 所示,在 30°和 50°衍射角附近出现了强度高且较 尖锐的衍射峰,表明此时 ZrO₂ 有晶态结构出现, 该晶态结构为四方相 ZrO_2 (t- ZrO_2)。当温度上升 至 500 ℃时,如图 1 (c) 所示,出现了少量单斜 相ZrO₂(m-ZrO₂)衍射峰,而t-ZrO₂相衍射峰明 显增强。通常情况下, ZrO₂在不同温度范围内有 3 种不同的晶体结构:常温下的 m-ZrO₂、1 170~ 2 370 ℃的 t-ZrO₂ 和在 2 370 ℃至熔点 (2 680 ℃) 的立方相 $(c-ZrO_2)^{[9]}$ 。本文用溶胶 – 凝胶法制备 的 ZrO₂ 在低温下为亚稳四方相稳定结构,可能是 因为非晶态短程有序但长程无序的特殊结构,在 XRD 衍射图中呈现出馒头状特征峰。从图 1(a) 可以看出,在 25 ℃时的非晶峰峰顶与 t-ZrO₂ 所具 有的最大衍射峰相对应,这说明 t-ZrO₂ 的晶体结 构与非晶态近程有序结构十分相似,而这种结构上 的类似性使非晶态 ZrO_2 向 t- ZrO_2 的转变只需克服





较低的晶格畸变能。所以凝胶中非晶态的 ZrO_2 更 易向 t- ZrO_2 转变,而不是析出通常低温情况下稳 定的 m- ZrO_2 晶体^[10]。图 1 (d) 所示 t- ZrO_2 衍射 峰强度高、清晰且尖锐,说明经 600 ℃热处理后, ZrO_2 已经基本完成了由非晶态向 t- ZrO_2 转变的过 程,且 m- ZrO_2 结晶相比例也得到了提高。

通常 t→m 转变温度为1045~975 ℃,但如图 1(e)所示,继续升温至700 ℃时 m-ZrO₂的衍射 峰强度有所增加,而 t-ZrO₂ 衍射峰强度急剧减弱, 表明该温度下晶体结构已开始由 t-ZrO₂ 向 m-ZrO₂ 转变。这是因为 t→m 的相变为马氏体相变,而相 变温度与晶粒尺寸间成正比关系,即晶粒尺寸越 小,相变温度越低。其中马氏体相变过程自由能变 化为^[11]

 $\Delta G_{t \to m} = \Delta G_{t \to m}^{0} + (A_m \gamma_m - A_t \gamma_t)$ (1) 式中: $\Delta G_{t \to m}$ 为单位体积 t-ZrO₂ 相变为 m-ZrO₂ 的 自由能变化; $\Delta G_{t \to m}^{0}$ 为单位体积 t-ZrO₂ 相变为 m-ZrO₂ 的化学自由能变化; γ_m 和 γ_t 分别为 m-ZrO₂ 和 t-ZrO₂ 的比表面能; A_t 和 A_m 为单位体积 t-ZrO₂ 相变前后总表面积。因为 m-ZrO₂ 的比表面 能大于 t-ZrO₂, 故有 t-ZrO₂ 晶粒粒径 R_t 与临界粒 径 R_0 , 满足

$$\begin{cases} R_{t} = R_{0}, \quad \Delta G_{t \to m} = 0 \\ R_{t} < R_{0}, \quad \Delta G_{t \to m} > 0 \\ R_{t} > R_{0}, \quad \Delta G_{t \to m} < 0 \end{cases}$$
(2)

理论上 t-ZrO₂ 稳定存在临界尺寸 R_0 约为 10 nm, 根据谢乐方程 $D = k\lambda/(\beta \cos \theta)$ 可计算晶粒尺寸 D, 其中,系数 k = 0.94, $\lambda = 0.154$ 06 nm 为 X 光波 长, θ 为布拉格角, β 为衍射峰积分半高宽^[12]。由 此可计算得出 700 ℃时晶粒尺寸为 30.7 nm,已远 大于临界尺寸,故此温度下干凝胶中稳定存在的主 要为 m-ZrO₂。

2.2 FTIR 分析

图 2 为对干凝胶经 400 ~ 700 ℃ 热处理后的 FTIR 谱图,图中 σ 为波数。图 2 (a)中, 3 421.2 cm⁻¹的宽广吸收对应 O—H 的伸缩振动, 1 556.3 和 1 444.4 cm⁻¹对应 Zr—O—C 的伸缩振 动吸收^[13],648 和 460.9 cm⁻¹对应 Zr—O 的伸缩 振动吸收,1 028 cm⁻¹对应有机基团。在 400 ℃ 时,480.2 cm⁻¹对应 t-ZrO₂ 结构的伸缩振动吸收, O—H 伸缩振动消失,表明材料中的水分已消除, 而由于材料中的有机成分逐渐被烧除,对应 1 028 cm⁻¹的吸收峰减弱。随着温度进一步升高, 574.7 cm⁻¹对应 t-ZrO₂ 伸缩振动吸收,图 2 (c) 和 (d) 中 424.3 和 732.8 cm⁻¹对应 m-ZrO₂ 伸缩 振动吸收^[14]。由此可知,随着热处理温度的升高, ZrO₂ 由水合向 t-ZrO₂ 和 m-ZrO₂ 转变,上述红外 分析结果与 XRD 分析结果相吻合。



图 2 不同热处理温度下 ZrO₂ 的红外光谱 Fig. 2 Infrared spectra of ZrO₂ at different annealing temperatures

2.3 AFM 分析

通过原子力显微镜观察到不同热处理温度下 ZrO₂薄膜试样的表面形貌,同时测得试样表面粗 糙度。ZrO₂薄膜表面形貌(扫描范围为 5 µm× 5 µm)如图 3 所示。图 3 (a)为 400 ℃热处理 ZrO₂薄膜表面 AFM 形貌图。从其二维形貌图中 可以看到,薄膜表面较为平整,高低起伏均匀,栅 状凹陷为基体表面划痕,表面粗糙度为 3.34 nm, 对应三维形貌图显示薄膜呈现高低起伏状并出现少 量晶粒,晶粒尺寸为 40 nm。500 ℃热处理时,图 3 (b) ZrO₂薄膜表面均匀平整,可见边界清晰的 晶粒,晶粒形态规则,均匀致密,表面粗糙度为 3.47 nm。三维图中,薄膜表面锥状晶粒明显增 多,但尺寸较小,整体起伏也较小,晶粒尺寸为 50.9 nm,而由于表面晶粒的长大,填充凹陷,使 基体表面划痕相对减少。图 3 (c)为 600 ℃热处 理温度下的薄膜形貌,由图可见薄膜表面大的晶粒 增多,颗粒排列密度降低,呈锥柱状结构,晶粒尺 寸为 70.1 nm,相邻颗粒之间存在较大起伏,表面 粗糙度增加到 5.3 nm。薄膜二维形貌图中可观察 到表面存在稀疏微孔,这是由于薄膜中的有机化合 物挥发后,热处理温度较低无法愈合而形成的^[15]。 当继续升温至 700 ℃,如图 3 (d)所示,薄膜表 面颗粒间间隙较大,结构较疏松,并由锥柱状晶变 成晶粒尺寸为 109 nm 的微块状颗粒,表面粗糙度 突变到 33 nm。薄膜表面凹凸不平且小部分区域有 团聚现象,这可能是因为随着温度的升高,存在于 凝胶中的液体不断析出使其中的纳米颗粒之间存在 大量空隙并形成凹液面,于是在毛细收缩作用下将 这些颗粒在某个方向上压在一起。同时,湿颗粒表



(a) 400 ℃时 ZrO₂ 薄膜
 二维表面形貌



(c) 400 ℃时 ZrO₂ 薄膜
 三维表面形貌



 (e) 600 ℃时 ZrO₂ 薄膜 二维表面形貌



(g) 600 ℃时 ZrO2 薄膜 三维表面形貌



 (b) 500 ℃时 ZrO₂ 薄膜 二维表面形貌



(d) 500 ℃时 ZrO₂ 薄膜
 三维表面形貌



 (f) 700 ℃时 ZrO₂ 薄膜 二维表面形貌



 (h) 700 ℃时 ZrO₂ 薄膜 三维表面形貌

图 3 不同热处理温度下 ZrO₂ 薄膜的表面形貌 AFM 图 Fig. 3 AFM images of the surface morphologies of ZrO₂ thin films at different annealing temperatures

176

面的非架桥羟基又形成了氢键,导致颗粒之间进一步接近而发生表面羟基氢键作用,进一步进行烧结,颗粒间产生真正的化学键合而形成难以分散的团聚体^[16]。

图 4 为 ZrO_2 薄膜表面粗糙度 (R_a) 及晶粒尺 寸 (D) 随热处理温度 (t) 的变化曲线。结合图 3 和图 4,可以看出表面粗糙度和晶粒尺寸的观察结 果有共同的突变位置。热处理温度低于 700 °C 时, 表面粗糙度与晶粒尺寸的值分别缓慢地由 3 34 nm 和 40 nm 变化为 5 3 nm 与 70 1 nm; 当热处理温度 升高到 700 °C 时,由于 t-ZrO₂ 转变为 m-ZrO₂ 的马 氏体相变,引起晶粒 3%~5%的体积膨胀,伴随着 体积变化而产生了晶粒膨胀不均的缺陷,表面粗糙 度与晶粒尺寸值迅速变大,达到 33 nm 和109 nm。



图 4 400~700 ℃时 ZrO₂ 薄膜表面粗糙度与晶粒尺寸的变化曲线 Fig. 4 Change curves of surface roughness and grain size of ZrO₂ thin films at 400-700 ℃

3 结 论

通过锆酸四丁酯水解缩聚制备的 ZrO₂,在室 温下为非晶态,低温下热处理先形成亚稳 t-ZrO₂, 在较高温度热处理后才向 m-ZrO₂ 转变。

经 400 ℃热处理后, ZrO₂ 薄膜表面晶粒尺寸 为 40 nm, 表面粗糙度为 3.34 nm。升温至 500~ 600 ℃时,薄膜表面粗糙度缓慢增大,晶粒尺寸增 加,晶粒由锥状向锥柱状变化,薄膜表面出现少量 凹陷。热处理温度达到 700 ℃后, ZrO₂ 薄膜表面 粗糙度与晶粒尺寸急剧增加到 33 nm 与 109 nm, 晶粒突变为微块状,薄膜表面凹凸不平且有小部分 团聚现象。故当热处理温度为 400 和 500 ℃时,通 过溶胶一凝胶法在不锈钢表面制得的 ZrO₂ 薄膜较 为光滑且可在低温下以 t-ZrO₂ 相结构存在。

参考文献:

- BEHZADNASAB M, MIRABEDINI S M, KABIRI K, et al. Corrosion performance of epoxy coatings containing silane treated ZrO₂ nanoparticles on mild steel in 3, 5% NaCl solution [J]. Corrosion Science, 2011, 53 (1): 89-98.
- [2] PAOLO S, ROSA D M, LUCA L, et al. Thermal expansion anisotropy of ceria-stabilized tetragonal zirconia [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1992, 75 (10): 2828-2832.
- [3] GURAPPA I. Development of appropriate thickness ceramic coatings on 316 L stainless steel for biomedical applications
 [J]. Surface and Coatings Technology, 2002, 161 (1): 70-78.
- [4] RAO X X, HU S B. The application development of nano-zirconia [J]. Materials Review, 2007, 21 (\]): 143-146.
- [5] DANG V S, BANERJEE M, ZHU H Z, et al. Investigation of optical, electrical, and mechanical properties of MOCVDgrown ZrO₂ films [J]. Chemical Vapor Deposition, 2014, 20 (8): 320-327.
- [6] PATEL K J, DESAI M S, PANCHAL C J. Studies of ZrO₂ electrolyte thin-film thickness on the all-solid thin-film electrochromic devices [J]. Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, 18 (8): 2600-2604.
- [7] LIANG B, ZHANG G, LIAO H L, et al. Structure and tribological performance of nanostructured ZrO₂-3 mol% Y₂O₃ coatings deposited by air plasma spraying [J]. Journal of Thermal Spray Technology, 2010, 19 (6): 1163-1170.
- [8] MIN D, HOIVIK N, JENSEN G U, et al. Dielectric properties of thin-film ZrO₂ up to 50 GHz for RF MEMS switches
 [J]. Applied Physics: A, 2011, 105 (4): 867-874.
- [9] MEI L F, LIANG K M, LI H B. Crystallization of t-ZrO₂ in zirconia powder prepared by sol-gel process [J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2005, 34 (z1): 72-75.
- [10] LI H B, LIANG K M, GU S R. Stability of t-ZrO₂ in zirconia powder prepared by sol-gel process [J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2001, 41 (10): 13-15.
- [11] WANG D Z, HOU B H, CHEN S Y, et al. Phase structure and size effect of nanometer ZrO₂ [J]. Journal of Instrumental Analysis, 1997, 16 (5): 1-4.
- [12] XU L L, CUI S, WU L A, et al. Preparation of zirconia powders by sol-gel process [J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39 (2): 501-503.

(下转第184页)

tal images used in convective heat transfer studies [J]. Journal of Turbomachinery, 1992, 114 (4): 765-775.

- [10] SABATINO D R, PRAISNER T J, SMITH C R. A high-accuracy calibration technique for thermochromic liquid crystal temperature measurements [J]. Experiments in Fluids, 2000, 28 (6): 497-505.
- [11] CHAN T L, ASHFORTH-FROST S, JAMBUNATHAN K. Calibrating for viewing angle effect during heat transfer measurements on a curved surface [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2001, 44 (12): 2209-2223.
- SYSON B J, PILBROW R G, OWEN J M. Effect of rotation on temperature response of thermochromic liquid crystal [J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 1996, 17 (5): 491-499.
- [13] CAMCI C, GLEZER B, OWEN J M, et al. Application of thermochromic liquid crystal to rotating surfaces [J]. Journal of Turbomachinery, 1998, 120 (1): 100-103.
- [14] 张兴,薛秀生,陈斌,等.示温漆在发动机测试中的应用与 研究 [J].测控技术,2008,27 (1):21-23.
- [15] 熊庆荣,石小江,徐芳,等. 基于示温漆的高压涡轮导向器 表面温度测试 [J]. 燃气涡轮试验与研究, 2014, 27 (3): 44-48.
- [16] LIEBERT C H, MAZARIS G A, BRANDHORST H W. Turbine blade metal temperature measurement with a sputtered thin film chromel-alumel thermocouple [R]. NASA STI/Recon Technical Report N, 1975, 76: 14124.
- [17] GRANT H P, PRZYBYSZEWSKI J S. Thin film temperature sensor [R]. NASA STI/Recon Technical Report N, 1980, 80: 17425.
- [18] GRANT H P, PRZYBYSZEWSKI J S, CLAING R G. Turbine blade temperature measurements using thin film temperature sensors [R]. East Hartford: Pratt and Whitney Aircraft, 1981.
- [19] GRANT H P, PRZYBYSZEWSKI J S, CLAING R G, et al. Thin film temperature sensors, phase 3 [R]. NASA STI/ Recon Technical Report N, 1982, 82: 22479.
- [20] MARTIN L C. Testing of thin film thermocouples in rocket engine environments [R]. Advanced Earth-to-Orbit Propulsion Technology, NASA CP-3282, 1994.

(上接第177页)

- [13] ATIK M, AEGERTER M A. Corrosion resistant sol-gel ZrO₂ coatings on stainless steel [J]. Journal of Non-crystalline Solids, 1992, 147/148 (16): 813-819.
- [14] CHEN S G, YU M Y, HU B G, et al. Structures and spectra characteristics of (ZrO₂)_n (1≤n≤5) clusters [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2007, 35 (1): 50-51.
- [15] LI H B, LIANG K M, MEI L F, et al. Corrosion protection of mild steel by sol-gel zirconia coatings [J]. Corrosion Science and Protection Technology, 2002, 14 (2): 92-94.
- [16]~ YANG Y G, HU X H, PANG M. The application of drying

- [21] ATKINSON W H, CYR M A, STRANGE R R. Development of sensors for ceramic components in advanced propulsion systems. phase 2: temperature sensor systems evaluation [R]. East Hartford: Final Report United Technologies Corp. 1994.
- [22] GREGORY O J, YOU T. Ceramic temperature sensors for harsh environments [J]. Sensors Journal, IEEE, 2005, 5 (5): 833-838.
- [23] GREGORY O J, BUSCH E, FRALICK G C, et al. Preparation and characterization of ceramic thin film thermocouples
 [J]. Thin Solid Films, 2010, 518 (21): 6093-6098.
- [24] CHEN X, GREGORY O J, AMANI M. Thin-film thermocouples based on the system In₂O₃-SnO₂ [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94 (3): 854-860.
- [25] BHATT H D, VEDULA R, DESU S B, et al. Thin film TiC/TaC thermocouples [J]. Thin Solid Films, 1999, 342 (1): 214-220.
- [26] MARTIN L C, WRBANEK J D, FRALICK G C. Thin film sensors for surface measurements in aerospace simulation facilities [C] //Proceedings of the 19th International Congress on Instrumentation in Aerospace Simulation Facilities. Cleveland, OH, USA, 2001: 196-203.



作者简介:

邓进军(1978—),男,江西九江人, 副教授,中国微米纳米技术学会会员,主 要从事流动测控微器件、应用微系统及微 纳米检测技术等领域的研究工作;



马炳和 (1972一), 男,河北辛集人, 教授,博士生导师,微纳系统实验室副主 任,主要从事航空航天微系统、微传感器 及先进测试技术研究,承担了国家自然科 学基金、863 计划、国家重大科学仪器设备 开发专项任务等重要科研课题。

techniques to prepare nanoscale powder [J]. Anhui Chemical Industry, 2005, 31 (2): 28-30.

作者简介:

冀国俊(1979—),男,内蒙古呼和浩特人,副教授,博士,主要从事表面涂层 方面的研究。